

2026 年 8 月 19 日

各 位

公司名 尼得科精密检测科技株式会社

代表人 董事长总经理 山崎 秀和

地 址 京都府向日市 Nidec Park 33 番地 C 栋

尼得科精密检测科技将参展 PCIM Asia Shenzhen 2026

尼得科精密检测科技株式会社将参展于 2026 年 8 月 26 日（星期三）～8 月 28 日（星期五）在深圳国际会展中心参展举办的“PCIM Asia Shenzhen 2026”。



该大会是亚洲地区最大规模的关于电力电子的专业国际展览会，汇集了电力转换、控制、供应等电力电子领域的技术和产品。

在本次展览会上，我公司将介绍与 IGBT/SiC 等功率半导体相关的前沿检测技术及检测产品。

此次将展示以下主力产品，并介绍有助于提升产品品质的解决方案。

〈亮点产品〉

■IGBT/SiC 功率半导体模块绝缘、静态特性及动态特性检测系统“NATS®-1000/1730”

这是一款最适合功率半导体模块出货前最终检测的检测系统。除了可对常温绝缘、高温静态特性、高温动态特性、常温静态特性这四个项目进行并行测试的自动检测设备外，我们还将为您介绍在研发阶段发挥作用的手动检测装置。

■IGBT/SiC 功率半导体内置 PCB 测试系统“NATS®-2120”

这是一款面向搭载了处理大功率、高电压功率半导体 PCB 及模块的检测设备。它能有效预防在高负荷环境下可能发生的误动作和热损坏，即使在严苛条件下也能确保产品的高质量。

诚邀您莅临本公司展位！

〈展会概要〉

- 会期：2026 年 8 月 26 日（星期三）～8 月 28 日（星期五）
- 会场：深圳国际会展中心（宝安馆）
- 展位：16H15
- 官网：pcimasia-shanghai.cn.messefrankfurt.com